

★信頼性研究会 (R)

専門委員長 土肥 正 副委員長 門田 靖

幹事 岡村寛之・井上真二 幹事補佐 横川慎二・吉川隆英・作村建紀

日時 11月17日(木) 14:00~16:15

会場 オンライン開催

議題 半導体と電子デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. 確率微分方程式モデルに基づくエッジサーバの最適化 ○藤田航平・田村慶信(山口大)・山田 茂(鳥取大)
2. Optimal Maintenance Interval for DU Fault of Safety-Related System
○Shinji Inoue (Kansai Univ.)・Shigeru Yamada (Tottori Univ.)
3. 電子部品における液晶高分子の高次構造制御による寸法安定化 ○今泉豊博・大谷 修(オムロン)
4. 信頼性を獲得するための工程能力指数 松岡敏成(三菱電機)
5. 階層ベイズモデルとフィルタリングに基づく故障検知の推論法 貝瀬 徹(兵庫県立大)

◆日本信頼性学会, IEEE Reliability Society Japan Chapter 共催

◎オンライン開催です。事前に参加形態を確認するため、参加予定の方【登壇者の方を含む】は所定の参加費をお支払いの上 Google Form : <https://forms.gle/N5kdCqZ9NGP6RxX46> から申込をお願いします。発表お申し込み時に、発表形態(今回はオンラインのみ)を備考欄に御記入下さい。

☆R 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月15日(木) (予定) オンライン開催〔締切済〕テーマ: 信頼性国際規格, 保全性, 信頼性一般, 安全性一般

【問合先】

井上真二(関西大)

E-mail : ino@kansai-u.ac.jp